技术资料 1.0版

LONGLITE® DRY FILM PHOTO RESIST

FF-9040S

长春化工(江苏)有限公司

江苏省常熟经济开发区沿江工业区长春路

Chang Chun Chemical (Jiangsu) Co., Ltd.

Changchun Rd., Riverside Industrial Park, Changshu Economic Development Zone, Jiangsu 215537, china

TEL: 86-512-5264-8000 (Rep)

FAX: 86-512-5264-5556

WEB: www.ccp.com.tw

LONGLITE® Dry Film Photo Resist FF-9040S 为负型、水溶性干膜光阻,具有良好的解像力与密着力,适用于细线路酸性蚀刻、Tenting、电镀铜等印刷电路板不同制程。

特性:

- 1. 具有优异的解像力。
- 2. 具有优异的附着力及覆盖力。
- 3. 具有优良的耐化学药品性与耐电镀特性。
- 4. 膜性柔韧, Tenting 特性优异。
- 5. 对电镀液污染性极低。
- 6. 曝光后颜色对比明显。

规格:

Туре	FF-9040S
Resist 厚度	38μm (1.5 mil)
标准宽度级距	0.125 inch
长度	500ft / roll

储存:

建议水平放置于干燥之冷藏库内,储存环境条件:温度5~20℃、相对湿度50±10%。

使用安全守则:

- 1. 在 UV-free 之黄色光源下使用,不使用时应以不透光布覆盖,并水平存放。
- 2. 压膜时会产生气味,应注意压膜室之排气。
- 3. 皮肤接触到光阻剂层可能会有刺激感,应避免直接碰触。使用后应以肥皂洗手,如果刺激 感持续,应就医检查。
- ❖LONGLITE[®]为长春公司之注册商标。
- ❖LONGLITE® Dry Film Photo Resist 为长春公司与东京应化工业株式会社(Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.)技术合作生产。

本资料所列数据为本公司依照实验所得结果而记载,并不作为质量保证之依据。

试验项目:

- 1. 显像时间、Break Point
- 2. 不同曝光能量下之再现性 -- 感度、解像性(线距)、密着性(线宽)、干膜线路宽度变化
- 3. 剥膜特性
- 4. 发色浓度
- 5. Tenting 特性

Test Conditions:

1. 基板: 1.6 mm D/S (铜厚度 35μm)

2. 前处理: Oscillation Buffering Polish (3M #320 → #500)

3. 预热: Batch type oven, 80° C, 10 min (压膜前基板表面温度约 50° C)

4. 压膜: 滚轮温度: 100℃

滚轮压力: 4.0 kg/cm²

速度: 2.0 M/min

5. Hold time: 压膜后 15 min

6. 曝光: UVE-M500 型 5KW 超高壓水銀燈

7. Hold time: 曝光后 15 min

8. 显像: 显像液: 1% Na₂CO₃ aq

温度: 29±1℃

喷压: $1.2 \sim 1.4 \text{ kg/cm}^2$

BP: 50%

9. 剥膜: 剥膜液: 2.0%、3.0%、4.0% NaOH

温度: 40℃、50℃、60℃

喷压: 浸泡式

1. 显像时间、Break Point

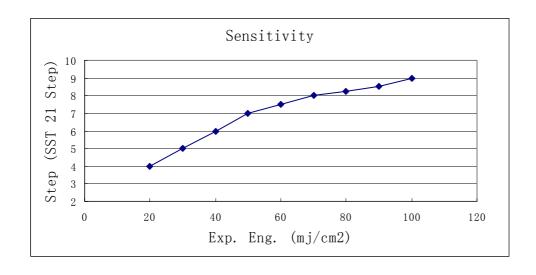
Break Point	23sec
显像时间(2 B.P.)	46sec

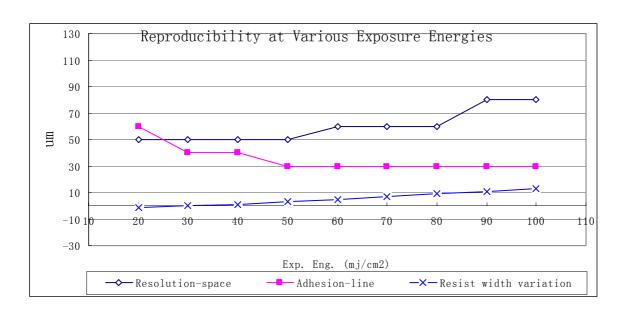
2. 不同曝光能量下之再现性:

项	目	感度	解像性(线距)	密着性(线宽)	干膜线宽度变化
单	位	(Step)	(µm)	(µm)	(µm)
	20	4	50	60	-1
	30	5	50	40	0
	40	6	50	40	1
呢 小. 具	50	7	50	30	3
曝光量	60	7.5	60	30	5
(mJ/cm ²)	70	8	60	30	7
	80	8.25	60	30	9
	90	8.5	80	30	11
	100	9	80	30	13

备注:

- a. Data for reference
- b. 感度: Stouffer 21 段曝格表(Stouffer 21 steps sensitivity guide)直接放置于干膜上,曝光、显像后记录残留之 step。
- c. 解像性:测试底片 CCP Pattern-1 (L/S=2/1), L 字型线路, 20~200μm。
- d. 密着性: 测试底片 CCP Pattern-1 (L/S=1/2), L 字型线路, 20~200μm。
- e. 干膜线路宽度变化: 计算显像后干膜线宽与测试底片线宽之差异,测试底片: L/S = 100/200μm。







3. 剥膜特性

剥膜液温度	40℃		50℃		60℃	
	剥离时间	剥离片形	剥离时间	剥离片形	剥离时间	剥离片形
剥膜液浓度	(sec)	状	(sec)	状	(sec)	状
2%	49-54	碎片	39-44	碎片	32-34	碎片
3%	41-48	片状有破	36-40	碎片	30-33	碎片
		П				
4%	38-49	整片状	33-38	片状有破	25-29	片状有破
				П		口

4. 发色浓度

曝光前	0.07
曝光后(8 Step)	0.37

5. Tenting 特性

强度(g)	349
时间(sec)	3.50

备注:

a. Data for reference

b. 曝光量: 8 Step

c. Gauge: \$2mm.

d. Speed: 10mm/min.

e. Board: \$\phi 6mm\$, thickness 1.6mm.

建议操作条件:

● 表面处理:

Type: 化学微蚀或研磨

水破试验: 至少 15~30 sec (直立)

▶ 板面仍有水时,勿以热风直接吹干。

▶ 建议表面粗糙度: R_a=0.2~0.4 μm , R_z=1.5~2.5 μm。

● 压膜:

贴膜温度: 55~65℃ 滚轮温度: 110±10℃ 贴膜压力: 2~5 kg/cm² 滚轮压力: 3~5 kg/cm² 速度: 1.0~3.0 m/min

入板温度: 40~60℃ 出板温度: 45~65℃

Holding time ①: $15 \text{ min} \sim 24 \text{ hr} (23\pm2^{\circ}\text{C}, 50\pm10\% \text{ RH})$

- ▶ 入板温度如果超过70℃,盖于镀通孔上之干膜有可能变较薄。
- ▶ 调整滚轮温度及压力时请依照压膜机使用手册之指示。
- ▶ 压膜后基板应直立放置冷却至室温。
- ▶ 压膜后之基板如果会在黄色 UV-free 光源放置超过 6 hr,务必以不透光布遮盖基板。

● 曝光:

Step: 6~9 step (SST 21 Step)

Holding time②: 15 min~24 hr (23 ± 2 °C, 50 ± 10 % RH)

▶ Holding time①与 Holding time②合计应小于 2 天。

● 显像:_

显像液: 0.7~1.0 wt% Na₂CO₃

温度: 26~30℃

喷压: $1.2\sim2.0 \text{ kg/cm}^2$

显像点: 1/2~2/3

▶ 建议水洗温度 15-25℃,水洗喷压 1.2-2.0 kg/cm²。

▶ 调节水洗槽流量以控制第一水洗槽能维持 pH 8 以下。

▶ 干膜负荷量:小于 10g/L。

● <u>蚀刻:</u>

Type: 氯化铜或氯化铁酸性蚀刻液

● 剥膜:_

脱膜液: 3.5±0.5 wt% NaOH or KOH

温度: 50~55℃

喷压: 1.5~3.0 kg/cm²

剥膜点: 1/2~2/3

▶ 干膜负荷量小于 20g/L。

▶ 建议水洗喷压大于 1.0kg/cm²。